

分治策略

李琦煜

杨思祺

张远鹏

算法设计与分析 2020 小班 17

2020 年 2 月 28 日

基本思想

设 P 是待求解的问题, $|P|$ 代表该问题的规模, 一般的分治算法思路:

- 如果 $|P|$ 不超过 c , 则直接求解。
- 如果 $|P|$ 超过 c , 则将 P 划分为子问题 P_1, P_2, \dots, P_k , 递归地依次求解并归并得到 P 的答案。

通常都是递归算法, 时间复杂度分析往往依赖于求解递推方程。

分析方法

- $T(n) = \sum_{i=1}^k a_i T(n-i) + f(n)$

- $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + d(n)$

第一类如汉诺塔分治算法，可以使用迭代、递归树、尝试法等求解。

第二类如二分检索和归并排序算法，可以使用迭代法、递归树、主定理等求解。

芯片测试

有 n 个芯片，其中好芯片比坏芯片至少多 1 片，需要通过测试从中找出 1 片好芯片。测试需要 2 片芯片互相测试，好芯片的报告是正确的，坏芯片的报告是不可靠的。请使用最少的测试次数找出 1 片好芯片。

芯片测试

- 如果剩下芯片数 k 为偶数，则分为 $\frac{k}{2}$ 两两测试并按照如下规则筛选芯片
 - ▶ 如果两片芯片报告都为好，则任取一片。
 - ▶ 否则两片芯片全都丢弃。
- 如果剩下芯片数 k 为奇数，则分为 $\lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ 和单独的一片，组内两两测试并按上述规则筛选，单独的一片和其他所有芯片测试
 - ▶ 如果报告为坏的次数多于报告为好的次数，则丢弃。
 - ▶ 如果报告为好的次数不少于报告为坏的次数，则该芯片为好芯片。
- 如果剩下的芯片数不超过 3，可以直接出解。

每轮至少筛去一半芯片，总时间复杂度 $T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n) = O(n)$ 。